

| | |
|-------------------------|--|
| 1. Record Nr. | UNINA9910139855303321 |
| Titolo | 2008 17th Asian Test Symposium : 24-27 November 2008 |
| Pubbl/distr/stampa | New York : , : IEEE, , 2008 |
| ISBN | 1-5090-8449-5 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (456 pages) |
| Soggetti | Fault-tolerant computing Electronic circuits - Testing Electronic digital computers - Circuits - Testing |
| Lingua di pubblicazione | Inglese |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |